

Aparato para la medida de temperatura y corriente de fugas en un chip

Información de contacto

Dirección: Principales:

- JOSE LUIS AYALA RODRIGO

jayala@ucm.es

- M. LUISA LOPEZ VALLEJO

m.lopez.vallejo@upm.es

- PABLO ITUERO HERRERO

pablo.ituero@upm.es

Tipo de oferta tecnológica

Patentes

¿Dónde?

Centro de Investigación en Simulación Computacional (CCS) Information Processing and Telecommunications Center (IPTC) Laboratorio de Sistemas Integrados (LSI)

Documentación

Descargar documentación adicional (jsp?id=181&id_archivo=101&tipo=patente&extension=fichero)

Descripción de la patente

Aparato para la medida de temperatura y corriente de fugas en un chip que proporciona una salida que varía linealmente con la temperatura. El aparato comprende un inversor de fugas y un módulo electrónico que digitaliza y linealiza la salida no lineal del inversor de fugas. Al proporcionar una respuesta lineal se reducen las necesidades de almacenamiento e interconexión de los datos, además se facilita la representación numérica de los mismos. El aparato se puede usar para medir variaciones de temperatura dentro de un chip y también para medir variaciones de la corriente de fugas, lo que a su vez conlleva medir variaciones de potencia estática dentro de un chip.

Situación

Concedida

Número de solicitud

P200702109

Número de publicación

ES2291143

Fecha de presentación

27/07/2007

Fecha de concesión

30/06/2008